

F4280 Technology of thin film deposition and surface treatment

6. Epitaxy

Lenka Zajíčková

Faculty of Science, Masaryk University, Brno &
Central European Institute of Technology - CEITEC

lenkaz@physics.muni.cz

spring semester 2021



Central European Institute of Technology
BRNO | CZECH REPUBLIC



Outline - Epitaxy

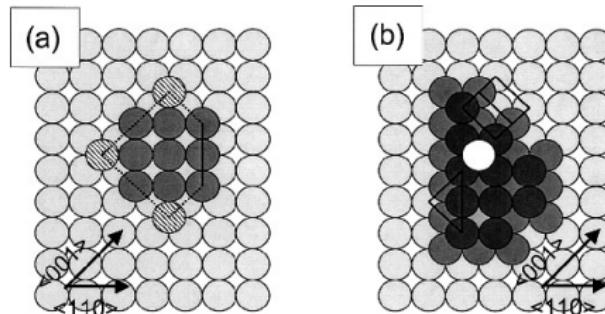
- **Epitaxy**
 - 6.1 Introduction to Epitaxy
 - 6.2 Vapor Phase Epitaxy
 - 6.3 Atomic Layer Epitaxy
 - 6.4 Liquid Phase Epitaxy
 - 6.5 Molecular Beam Epitaxy
 - 6.6 Monitoring of Deposition Process

6.1 Introduction to Epitaxy

The word epitaxy is derived from the Greek “epi” - upon and “taxis” - to arrange. Thus, epitaxial deposition requires the ability to add and arrange atoms upon a single crystal surface. **Epitaxy is a regularly oriented growth of one crystalline substance upon another.**

Two different kinds of epitaxy are recognized:

- ▶ Homo-epitaxy is growth in which the epitaxial layer is of the same material as the substrate (e.g. Si on Si, GaAs on GaAs).
- ▶ Hetero-epitaxy is growth in which the layer is a different material than the substrate (e.g. Si on saphire, AlAs on GaAs).



Applications

Specific applications require controlling the crystalline perfection and the dopant concentration in the added layer. It is important for applications that places stringent demands on the deposited layer:

- ▶ high purity
- ▶ low defect density
- ▶ abrupt interfaces
- ▶ controlled doping profiles
- ▶ high reproducibility and uniformity

Why homoepitaxy (e. g. Si on Si, GaAs on GaAs)?

Epitaxial films are purer than the substrate and can be doped independently.

6.2 Vapor Phase Epitaxy (VPE) or CVD Epitaxy

Epitaxial layers can be prepared by a wide range of techniques including evaporation, sputtering and molecular beams. **Epitaxial deposition by CVD (or vapor phase epitaxy - VPE)** uses a gaseous transport and chemical reactions - all previously discussed steps of the CVD deposition

- ▶ arrival: bulk transport of reactants, diffusion of reactants towards the surface, adsorption
- ▶ surface reactions: surface reaction (reaction can also take place in the gas volume immediately above the surface), surface diffusion, crystal lattice incorporation
- ▶ removal of by-products: reaction by-product desorption, gaseous transport of by-products, bulk transport of by-products out of process volume

see <https://www.slideshare.net/mehmedkoc/ee518-epitaxial-deps07-5695497>

for epitaxy in general and vapor phase epitaxy (VPE)

Successful epitaxy depends upon having:

- ▶ Well-prepared crystalline substrate without defects and surface layers (e.g. oxide)
- ▶ High surface mobility for the arriving atoms.
- ▶ Numerous, equivalent growth sites.

Silicon Epitaxy

Important application of VPE is a production of crystalline silicon (c-Si). With the **silicon epitaxy** radical changes in material properties can be created over small distances within the same crystal. This capability permits the growth of lightly-doped single c-Si on the top of heavily-doped c-Si, n-type Si over p-type Si and vice versa, Si layer with controlled dopant profiles etc.

see Handbook of Thin Film Deposition, ed. S. Krishna, chapter 2.

Chemistry	Growth Rate (microns/minute)	Temperature Range (°C)	Allowed Oxidizer (ppm)
SiCl_4	0.4–1.5	1150–1250	5–10
SiHCl_3	0.4–3.0	1100–1200	5–10
SiH_2Cl_2	0.3–2.0	1050–1150	<5
SiH_4	0.1–0.3	950–1050	<2

Silicon Epitaxy

Doping

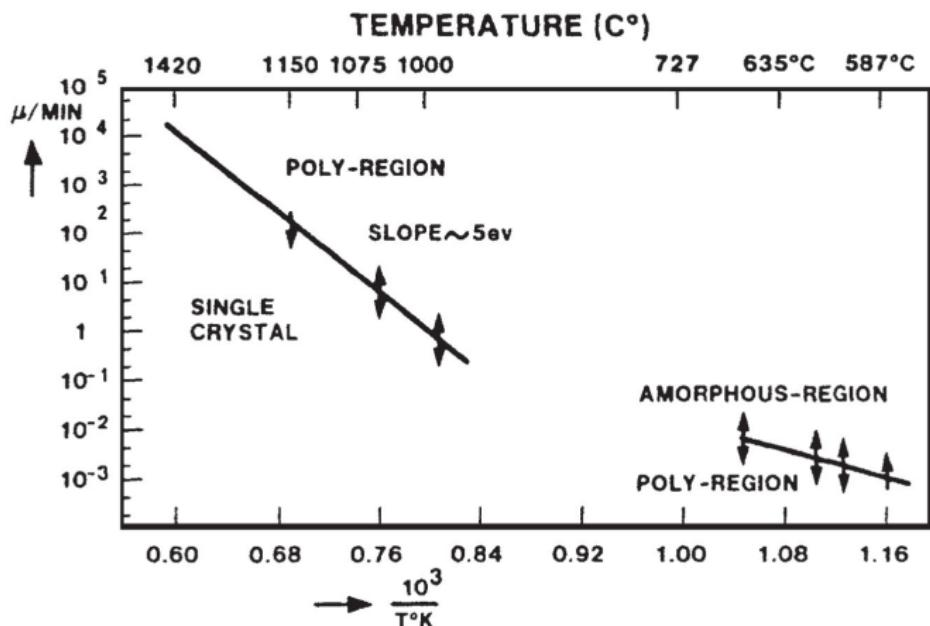
- ▶ B for p-type
- ▶ P, As for n-type

Periodic Table of the Elements

Periodic Table Labels:

- Groups:** 1 (IA), 2 (IIA), 3 (IIIA), 4 (IVA), 5 (VA), 6 (VIA), 7 (VIIA), 8 (VIII), 18 (VIIIA).
- Periods:** 1 through 18.
- Series:** Lanthanide Series (row 57), Actinide Series (row 89).
- Elements:** Hydrogen (H), Helium (He), Lithium (Li), Beryllium (Be), Sodium (Na), Magnesium (Mg), Potassium (K), Calcium (Ca), Scandium (Sc), Titanium (Ti), Vanadium (V), Chromium (Cr), Manganese (Mn), Iron (Fe), Cobalt (Co), Nickel (Ni), Copper (Cu), Zinc (Zn), Gallium (Ga), Germanium (Ge), Arsenic (As), Selenium (Se), Bromine (Br), Krypton (Kr), Rubidium (Rb), Strontium (Sr), Yttrium (Y), Zirconium (Zr), Niobium (Nb), Molybdenum (Mo), Technetium (Tc), Ruthenium (Ru), Rhodium (Rh), Palladium (Pd), Silver (Ag), Cadmium (Cd), Indium (In), Tin (Sn), Antimony (Sb), Tellurium (Te), Iodine (I), Xenon (Xe), Cesium (Cs), Barium (Ba), Hafnium (Hf), Tantalum (Ta), tungsten (W), Rhenium (Re), Osmium (Os), Iridium (Ir), Platinum (Pt), Gold (Au), Mercury (Hg), Thallium (Tl), Lead (Pb), Bismuth (Bi), Polonium (Po), Radon (Rn), Francium (Fr), Radium (Ra), Ruthenium (Ru), Dubnium (Db), Seaborgium (Sg), Bohrium (Bh), Hassium (Hs), Meitnerium (Mt), Darmstadtium (Ds), Rutherfordium (Uut), Ununquadium (Uup), Ununhexium (Uuh), Ununseptium (Uus), Ununoctetium (Uuo).

Silicon Epitaxy



6.3 Atomic Layer Epitaxy

analogy to ALD, see Smith's book p. 269

6.4 Liquid Phase Epitaxy

LPE - high T solution growth technique

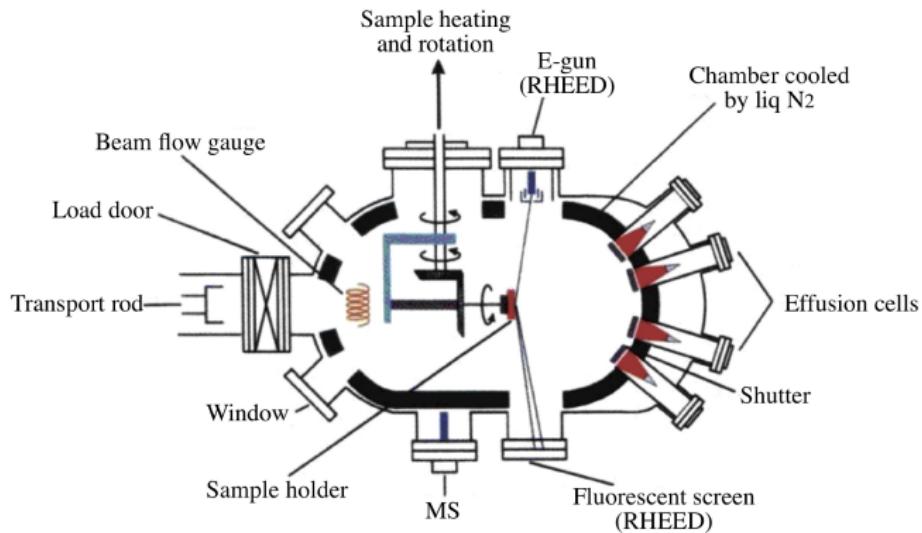
see https://www.slideshare.net/HrishikeshGhewade/epitaxial-crystal-growth-method?next_slideshow=1
- epitaxy in general, liquid phase epitaxy (LPE) and MBE

6.5 Molecular Beam Epitaxy

Epitaxe z molekulárních svazků (MBE z anglického molecular beam epitaxy) je sofistikovaná, přesně kontrolovaná metoda pro růst monokrystalické epitaxní vrstvy:

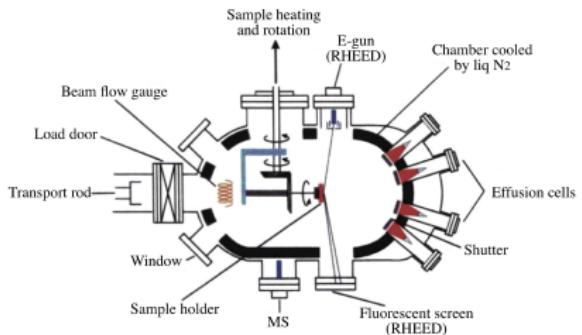
- ▶ ve velmi vysokém vakuu (10^{-9} Pa),
- ▶ na monokrystalickém substrátu pomalým napařováním jednotlivých atomů či molekul,
- ▶ substrát a rostoucí vrstva udržovány na přesně dané teplotě.

Aparatura pro MBE:



6.5 Molecular Beam Epitaxy

- ▶ **Vakuový systém** je velice podobný uspořádání, které je používáno pro analýzu povrchů a kompatibilní s technikou vysokého vakua. Typický systém pro MBE je složen ze čtyř oddělených komor: vstupní komora pro vkládání a vyjmání substrátů, depoziční komora, komora pro analýzu a pomocná komora pro přípravné procesy.
- ▶ **Zdroje materiálu** jsou základem každého MBE systému. Musí být schopné poskytovat dostatečnou čistotu a rovnoměrnost napařovaného materiálu.
- ▶ **Clona** Jedním ze základních prvků, nutných pro správnou funkci MBE, je clona umístěná na zdroji. Spolu s pomalou rychlosťí růstu vrstvy umožňuje kontrolu nad procesem růstu. Požadavkem je schopnost zavřít se během 0,1 s.
- ▶ **Manipulace se vzorky**. Vzorky pro MBE jsou uchyceny v molybdenovém držáku pomocí indiového tmelu. Za teploty obvyklé pro MBE je indium tekuté a zajišťuje dobrou přilnavost a převod tepla. Teplota substrátu bývá kontrolována buď termočlánkem, nebo pyrometrem. Obvyklé bývá velké substráty ($> 5 \text{ cm}$) nechat během depozice rotovat.



Typy zdrojů pro MBE

- ▶ **Knudsenovy cely** jsou standartním zdrojem pro napařování. Vypadají jako hluboké tyglíky uvnitř pece. Pec je vybavena chlazením stěn a termočlánkem. Jsou většinou vyrobeny z odolného kovu jako je Ta, Mo nebo keramiky.
- ▶ **Solid Source Cracking Cells.** Některé materiály jako arsen a fosfor se odpařují ve více molekulárních formách. Obvykle platí, že větší molekuly mají vyšší tenzi par a nižší koeficient ulpění při dané teplotě substrátu než měnší molekuly ⇒ výtěžnost lze zvýšit rozbitím větších molekul již ve zdroji. Konstrukce zdroje materiálu v tomto případě odpovídá obvyklé Knudsenově cele s tím rozdílem, že je přidán další ohřev na výstupu z cely, který slouží k rozkladu molekul.
- ▶ **Kontinuální zdroj** je typ zdroje pro tekuté materiály (např. rtuť).
- ▶ **Zdroj s elektronovým ohřevem** je používán pro těžko tavitelné materiály (W, Co, Ni, Si, Ge).
- ▶ **Implantační zdroj** Plyn ze zdroje je ionizován, v některých případech jsou ionty separovány podle hmotnosti. Následně jsou ionty urychleny směrem k substrátu.

For more details see scanned copy of Handbook of Thin Film Deposition.

<https://www.youtube.com/watch?v=NsGRKSV8yH8&nohtml5=False> Simulation of growth

6.6 Monitoring of Deposition Process

- ▶ control of epitaxy - reflectance high-energy electron difraction RHEED

Electrons of energy 5 - 40 keV are directed towards the sample. They reflect from the surface at a very small angle (less than 3°) and are directed onto a screen. These electrons interact with only the top few atomic layers and thus provide information about the surface.

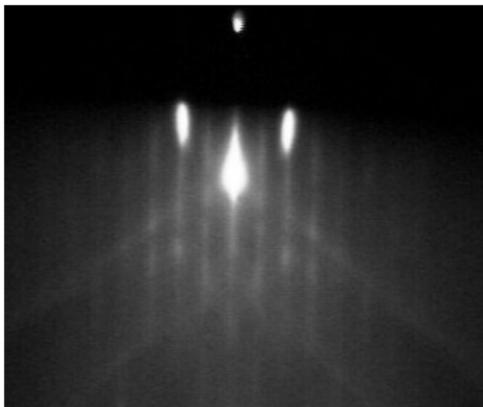
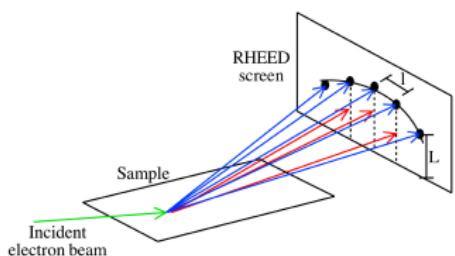


Figure shows a typical pattern on the screen for electrons reflected from a smooth surface, in which constructive interference between some of the electrons reflected from the lattice structure results in lines. If the surface is rough, spots will appear on the screen.

For more details see scanned copy of Smith's book.